Фотолюминесценция в германии с квазиравновесной дислокационной структурой

© С.А. Шевченко, А.Н. Терещенко

Институт физики твердого тела Российской академии наук, 142432 Черноголовка, Московская обл., Россия E-mail: shevchen@issp.ac.ru, tan@issp.ac.ru

(Поступила в Редакцию 17 апреля 2006 г.)

В монокристаллах германия *n*-типа с квазиравновесной структурой 60° дислокаций исследовалась дислокационная фотолюминесценция (ДФЛ) при 4.2 К. Показано, что спектры ДФЛ описываются совокупностью 8–13 гауссовых линий шириной менее 15 meV. С учетом литературных данных гауссовы линии с энергиями максимумов 0.47 < $E_m \leq 0.55$ eV приписаны излучению 90° частичных дислокаций Шокли в составе квазиравновесных отрезков 60° дислокаций с разными значениями ширины Δ дефекта упаковки: $\Delta = \Delta_0$, $\Delta < \Delta_0$ и $\Delta > \Delta_0$. Установлено, что линия d8 с энергией $E_m = 0.513$ eV, которая соответствует излучению прямолинейных отрезков с равновесным значением Δ_0 , доминирует в спектрах ФЛ только при плотности дислокаций $N_D < 10^6$ cm⁻². При увеличении N_D интенсивность линии d8 уменышается, а в спектре доминируют сначала линия d7 ($E_m \approx 0.507$ eV), а затем линии d7 и d6 ($E_m \approx 0.501$ eV), которые связываются с излучением отрезков с $\Delta < \Delta_0$. Обсуждаются возможные причины появления значений $\Delta \neq \Delta$ для квазиравновесных дислокаций.

Работа выполнена при поддержке программы Президиума РАН П-03 "Квантовая макрофизика".

PACS: 78.55.-m, 61.72.Hh, 61.72.Lk

1. Введение

В [1–3] показано, что в германии спектры фотолюминесценции (ФЛ), связываемой с 60° расщепленными дислокациями, чувствительны к структуре ядра, которая определяется режимом деформации.

Согласно [4], двухстадийная деформация кристаллов германия и кремния способствует образованию длинных (~1µm) прямолинейных отрезков 60° дислокаций со значениями ширины дефекта упаковки (ДУ) Δ_n , отличающимися от равновесного значения Δ_0 . При этом кристаллы деформируются сначала при высокой температуре и низких сдвиговых напряжениях τ_1 (первая стадия), а затем при низкой температуре и высоких напряжениях т₂ с последующим охлаждением в нагруженном состоянии почти до комнатной температуры (вторая стадия). В спектрах ФЛ, измеренных при 4.2 К на образцах германия после второй стадии деформации, наблюдается четырнадцать закономерно расположенных линий шириной $\sim 3 \,\mathrm{meV}$, энергия максимумов E_n которых увеличивается с ростом Δ_n в соответствии с эмпирической формулой, приведенной в [3]. Эти линии обусловлены излучением 90° частичной дислокации Шокли в составе 60° расщепленной дислокации, а потенциал 30° частичной дислокации Шокли является возмущением, величина которого зависит от расстояния Δ_n . Номер линии связан с шириной ДУ соотношением $n = (\Delta_n/a) - 6$, где a = 0.346 nm — шаг изменения Δ_n . В этих спектрах линия с номером n = 8и энергией $E_8 = 0.513 \text{ eV}$, названная линией d8, соответствует равновесному значению Δ_0 , а каждая линия с номером $n \neq 8$ — определенному неравновесному ("замороженному") значению Δ_n . При увеличении *n* линии сгущаются к предельной энергии $E_{\infty} = 0.55$ eV, которая соответствует максимальному удалению 30 и 90° частичных дислокаций Шокли друг от друга. Неравновесные расщепления и линейчатый спектр дислокационной ФЛ (ДФЛ) исчезают после отжига этих образцов при температурах выше 150°C.

Дислокационная структура, которую мы называем квазиравновесной, формируется при релаксации внутренних напряжений в процессе охлаждения образцов в разгруженном состоянии после первой стадии деформации, а также после отжига деформированных образцов в широком интервале температур. Такой дислокационной структуре соответствует широкая полоса ФЛ, состоящая из группы неразрешенных уширенных линий [1,5]. Одной из возможных причин появления такого спектра ДФЛ могло бы быть присутствие квазиравновесных 60° дислокаций с разными значениями ширины ДУ. Целью настоящей работы является проверка этого предположения.

2. Методика эксперимента

Для исследований использовались монокристаллы германия *n*-типа с концентрацией химических доноров (сурьма) ~ 10^{14} cm⁻³. Для изучения деформации вырезались параллелепипеды, ограниченные плоскостями {110}, {118} и {441} (группа I) или {110}, {001} и {110} (группа II). Плоскость {118} наклонена под углом 10° к плоскости {001}. Поэтому при небольших нагрузках в первом случае активной была одна плоскость скольжения {111}, а во втором — две эквивалентные плоскости скольжения {111}. Кристаллы

	Энергия	n										т			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	8	1	2	3
	E_n	477.6	488.8	498.2	506.2	512.9	518.6	523.5	527.6	531	540.6	550			
	<i>E_m</i> (рис. 2)	477.6	488.8	502.5	507.9	513.2	517.4	523.2		530	541.5	550	557	565	575
	<i>E_m</i> (рис. 3)	478.1	489	500.8	506.2	512.4	518.6	524		530.5	540	550	557.5	565	576
	<i>E_m</i> (рис. 4)	479.1	492.2	501.8	506.3	512.4	517.6	523.5		531.3	541	551	557.4	565.4	575.6
	E_m (рис. 5)		488.8	498.2	506.2		517.7	523.5	527.5		540	550	556	565.3	573.4

Энергии *E_n* для некоторых номеров *n* из [2] и энергии *E_m* гауссианов для спектров на рис. 2–5 (энергии приведены в meV)

деформировались четырехточечным изгибом вокруг оси (110) при температуре $T_d = 430^{\circ}$ С. На плоскости $\{118\}$ и {001} вдоль длинной грани наносилась царапина, которя была источником дислокаций в виде полугексагонов. Под действием приложенного напряжения полугексагоны двигались в глубь кристалла и расширялись. Для обеих геометрий деформируемых кристаллов дно полугексагона представляет собой 60° дислокацию, что позволяет получить вблизи нейтральной плоскости в основном 60° дислокации, расположенные вдоль оси изгиба (110). По окончании деформации кристаллы охлаждались до комнатной температуры в разгруженном состоянии. После химического травления и подсчета плотности дислокаций из деформированных кристаллов вырезались образцы для исследования ФЛ при 4.2 К. $\Phi\Pi$ возбуждалась фотонами с длиной волны $\lambda = 920 \, \mathrm{nm}$ (которые генерировались лазером на основе арсенида галлия при мощности 1 W/cm²) и измерялась в интервале энергий 0.47-0.73 eV с помощью стандартной фазочувствительной методики с охлаждаемым германиевым фотосопротивлением в качестве детектора при оптической ширине щели монохроматора 3.3 meV [1-3].

3. Экспериментальные результаты

Как видно из рис. 1 и 2, в образцах германия с квазиравновесными 60° дислокациями линия d8 с энергией 0.513 eV доминирует в спектрах ДФЛ при относительно небольших ($N_D = 3 \cdot 10^5 \, {\rm cm}^{-2}$) плотностях дислокаций. Подобный спектр наблюдался и в образце с $N_D \sim 10^4 \,\mathrm{cm}^{-2}$, но интенсивность линии d8 была значительно ниже. О присутствии других (менее интенсивных) линий свидетельствуют изломы и слабые максимумы в спектрах слева и справа от линии d8, что более отчетливо выражено в образце с двумя активными плоскостями скольжения (рис. 2). При увеличении плотности дислокаций возрастает интенсивность плеча слева от линии d8. Это приводит к появлению еще одного максимума, амплитуда которого при $N_D = 5 \cdot 10^6 \,\mathrm{cm}^{-2}$ немного меньше амплитуды максимума с энергией 0.513 eV (рис. 3) и растет при дальнейшем увеличении N_D (этот спектр мы не приводим). Два доминирующих максимума в окрестности линии d8 наблюдаются и после отжига деформационных точечных дефектов при 680°C в образце с $N_D = 5.5 \cdot 10^6 \,\mathrm{cm}^{-2}$ (рис. 4). Такой отжиг существенно не изменяет соотношения интенсивностей этих максимумов. Положение более слабых максимумов и изломов справа от линии d8 на рис. 2–4 и в спектрах других образцов совпадает. Экситонная ФЛ регистрировалась только в образце с $N_D \sim 10^4$ сm⁻².

Спектры ДФЛ, полученные в данной работе и [1], были разложены на гауссовы линии. Исходные значения энергий максимумов E_m отдельных линий задавались (фиксировались) с учетом положения максимумов и изломов на экспериментальных кривых, причем для энергий $E < E_{\infty} = 0.55 \,\text{eV}$ подбирались значения E_n , соответствующие некоторым неравновесным величинам Δ_n для узких линий из работы [2], которые приведены в таблице. Оказалось, что проанализированные спектры можно описать совокупностью 8–13 гауссовых линий со значениями E_m , отвечающими оптимальному совпадению экспериментальной и суммарной аппроксимирующей кривых. Из таблицы следует, что разброс значе-



Рис. 1. Спектр ФЛ в образце № 1 группы I с $N_D = 3 \cdot 10^5 \, {\rm cm}^{-2}$.



Рис. 2. Спектр ФЛ в образце № 1 группы II с $N_D = 3 \cdot 10^5 \text{ cm}^{-2}$. *1* — экспериментальные точки, *2* — суммарная аппроксимирующая кривая, *3*, *4* — гауссианы с энергиями $E_n \le 0.55 \text{ eV}$ и $E_m > 0.55 \text{ eV}$ соответственно, *5* — линия *d*8.



Рис. 4. Спектр ФЛ в образце № 3 группы I после отжига при 680°С ($N_D = 5.5 \cdot 10^6 \text{ cm}^{-2}$). Обозначения те же, что и на рис. 2.



Рис. 3. Спектр ФЛ в образце № 2 группы I с $N_D = 5 \cdot 10^6 \text{ сm}^{-2}$. Обозначения те же, что и на рис. 2.



Рис. 5. Спектр ФЛ в образце с $N_D = 1 \cdot 10^7 \text{ cm}^{-2}$ после отжига при 680°С, взятый из работы [4]. Обозначения те же, что и на рис. 2.

ний E_m для разных образцов и различие значений E_n и соответствующих значений E_m в основном не превышают 2 meV. Поэтому линиям с энергиями $E_m \leq 0.55 \text{ eV}$ приписаны те же номера, что и для неравновесного случая [2,3], а линиям с энергиями $E > E_{\infty}$ — номера m = 1, 2 и 3. Из рис. 2–4 видно, что ширина большинства линий в 2–3 раза больше ширины линии d8.

Результаты, представленные на рис. 2-4, показывают, что при увеличении плотности дислокаций изменяется соотношение между интенсивностями гауссовых линий. Максимум слева от линии d8 на рис. 3 и 4 появляется изза усиления линии d7. Согласно [1], в деформированных образцах германия *n*-типа после отжига при 680°С энергии максимумов длинноволновой доминирующей полосы I в спектрах ФЛ равны 0.513, 0.506 и 0.5 eV при $N_D = 2.5 \cdot 10^5$, $2.5 \cdot 10^6$ и $1 \cdot 10^7 \,\mathrm{cm}^{-2}$ соответственно. Разложение этих спектров на гауссовы линии показало, что в первом образце доминирует линия d8, во втором — d7, а в третьем (рис. 5) сильно возросла интенсивность линии d6, а линия d8 вообще отсутствует. С учетом спектров, полученных в данной работе, это означает, что по мере возрастания плотности дислокаций сначала усиливается линия d7, а затем и линия d6, т.е. идет "перекачка" рекомбинационного излучения в длинноволновые компоненты.

Усилению относительной интенсивности линий с m = 1, 2 и 3 при энергиях E > 0.55 eV способствуют увеличение числа активных плоскостей скольжения (рис. 2) и (в согласии с [1]) отжиг деформированных образцов при температуре 680°С (рис. 4).

4. Обсуждение результатов

О реальности присутствия прямолинейных отрезков квазиравновесных 60° расщепленных дислокаций с разными значениям Δ в ковалентных полупроводниках свидетельствуют следующие факты.

1) Методом просвечивающей электронной микроскопии в слабых пучках доказано, что в пластически деформированных кристаллах германия и кремния расщепленные отрезки квазиравновесных дислокаций разделены стяжками ДУ, которые в большинстве случаев представляют собой ступеньки разной высоты, а иногда — отрезки нерасщепленных дислокаций [6-8]. На электронномикроскопических изображениях дислокаций в германии при $N_D > 10^7 \, \text{cm}^{-2}$ видно много расщепленных отрезков длиной 10-100 nm. В [6] наблюдали локальные сужение и расширение ДУ вдоль расщепленных отрезков, постоянство величины Δ для отрезков длиной больше некоторой критической длины L_c и постепенное уменьшение Δ при L < L_c из-за линейного натяжения частичных дислокаций. Для краевых расщепленных дислокаций были определены $L_c \sim 100$ nm, а также $\Delta_0 = 4.8 \pm 0.6$ nm при L > 100 nm и pprox 3.0 nm при L pprox 20 nm. Таких данных для 60° дислокаций авторы не привели.

2) В процессе пластической деформации германия при 430°С генерируются также акцепторные центры, создающие мелкие (< 0.04 eV) уровни вблизи потолка валентной зоны, которые представляют собой примеси или их комплексы с вакансиями и междоузельными атомами и называются деформационными точечными дефектами (ТД) [8]. При $N_D \sim 10^7 \, {\rm cm}^{-2}$ концентрация этих дефектов достигает значения $\sim 10^{16}\,{
m cm^{-3}}$ и уменьшается после отжига образцов в интервале температур 400-700°С. В присутствии деформационных ТД ширина ДУ для дислокаций, близких к винтовой ориентации, увеличивается до значения $\sim 60\,\mathrm{nm}$, а после их отжига при 520°C уменьшается до расчетного значения $\sim 30\,\mathrm{nm}$. Поскольку винтовая дислокация расщеплена на две 30° частичные дислокации Шокли, аномально большое расщепление обусловлено с большой вероятностью взаимодействием ТД с этими частичными дислокациями. Тогда нельзя исключить некоторого влияния ТД и на ширину ДУ 60° дислокаций, расщепленных на 30 и 90° частичные дислокации Шокли. Из рис. 5 работы [8] видно, что максимальный разброс измеренных значений Δ для 60° дислокаций наблюдается в случае аномально большого расщепления дислокаций, близких к винтовой ориентации. Однако небольшое число экспериментальных точек и большая ошибка определения Δ_0 (±0.9 nm при шаге изменения Δ, равном 0.346 nm) не позволяют использовать эти данные как доказательство влияния деформационных ТД на ширину ДУ 60° дислокаций. По данным [8–10], средние значения Δ_0 для 60° дислокаций в германии равны 4.9, 4.6 и 3.9 nm соответственно.

3) В идеальных кристаллах равновесное значение Δ_0 достаточно длинных прямолинейных отрезков 60° полных дислокаций определяется балансом энергий ДУ и упругого отталкивания между 30 и 90° частичными дислокациями Шокли, так что после второй стадии деформации величина Δ_n должна зависеть только от величины сдвигового напряжения τ_2 [4]. Однако в реальных кристаллах кремния и германия каждому фиксированному значению τ_2 соответствует некий набор измеренных значений Δ_n (вместо одного значения) [4,10]. При этом характер изменения величины Δ_n для 60° дислокаций зависит от того, является ли 90° частичная дисклокация Шокли лидирующей (PK) или ведомой (PU): дислокации PK расширены, а PU сужены по сравнению со значением До. Эти факты были объяснены разной подвижностью лидирующей и ведомой дислокаций, причем подвижность 90° частичной дислокации Шокли выше подвижности 30° частичной дислокации. По мнению авторов, одной из причин более низкой подвижности 30° частичной дислокации Шокли может быть сложная структура ее ядра, предполагающая присутствие собственных ТД (по данным электронной микроскопии высокого разрешения). О разбросе значений Δ_n после второй стадии деформации при определенном значении т₂ свидетельствует также наблюдение нескольких (вместо одной) узких линий в спектрах ДФЛ образцов германия, содержащих деформационные ТД [2,3].

4) Закрепление одной ведомой частичной дислокации на некоторых препятствиях способствует образованию отрезков 60° дислокаций с большими (\geq 100 nm) значениями Δ [4].

5) В пластически деформированных кристаллах кремния получены разные значения Δ_0 для 60° дислокаций, в которых 90° частичная дислокация Шокли является ведущей или ведомой [11]. В [12] обнаружили, что величина Δ_0 зависит от состава кристалла по примесям. Большой разброс средних значений Δ_0 для расщепленных дислокаций в пластически деформированных кристаллах кремния, выращенных методом Чохральского, связывается с влиянием внутренних напряжений [13].

Все изложенное в пунктах 1-5 дает основание приписать рекомбинационное излучение с энергиями $0.47 < E \le 0.55 \,\mathrm{eV}$ прямолинейным отрезкам квазиравновесных 60° дислокаций со значениями $\Delta = \Delta_0, \Delta < \Delta_0$ и $\Delta > \Delta_0$. В согласии с [6] мы полагаем, что значение Δ_0 соответствует прямолинейным отрезкам 60° дислокаций длиной $L \ge L_c \gg \Delta_0$. При $\Delta_0 \approx 5 \,\mathrm{nm}$ с учетом меньшего линейного натяжения 90° частичных дислокаций Шокли по сравнению с 60° частичными дислокациями Шокли, на которые расщеплены краевые дислокации, в качестве оценочного значения критической длины L_c можно взять $L_c \sim 10\Delta_0 \sim 50$ nm. Отклонение Δ от Δ_0 мы связываем с влиянием неоднородного поля внутренних напряжений в пластически деформированных кристаллах и линейного натяжения частичных дислокаций Шокли в составе отрезков длиной L < 50 nm. Первый фактор может приводить к увеличению и уменьшению Δ , а второй — к уменьшению Δ , причем короткие расщепленные отрезки могут иметь форму линз [6]. Усиление интенсивности линий d7 и d6, которые при такой интерпретации соответствуют значениям $\Delta = \Delta_0 - a$ и $\Delta = \Delta_0 - 2a$, на рис. 3-5 согласуется с ростом числа ступенек и коротких отрезков дислокаций при увеличении плотности дислокаций под воздействием приложенного внешнего напряжения и локальных упругих напряжений в присутствии различных дефектов [14]. Это позволяет понять, почему линия d8 может не наблюдаться в образцах, содержащих 60° дислокации (рис. 5). Реализация тех или иных значений $\Delta \neq \Delta_0$, а следовательно, и относительная амплитуда разных линий зависят, вероятно, также от состава кристаллов по примесям и условий деформации.

5. Заключение

Таким образом, приведенная в настоящей работе совокупность данных позволяет объяснить многокомпонентность квазиравновесного спектра ДФЛ в германии при энергиях ниже 0.55 eV излучением прямолинейных отрезков 60° дислокаций с разными значениями Δ . Вместо одной линии d8, появления которой можно было ожидать для идеального кристалла, содержащего 60° дислокации, в реальных кристаллах присутствует около десяти линий. Если предложенная интерпретация верна, то спектры ДФЛ отражают распределение значений Δ для 60° полных дислокаций в реальных деформированных кристаллах. Для выяснения природы трех линий с энергиями $E > 0.55 \,\text{eV}$ требуются дополнительные исследования.

Авторы выражают благодарность В.В. Кведеру, Э.А. Штейнману и А.И. Колюбакину за обсуждение результатов работы и критические замечания.

Список литературы

- А.И. Колюбакин, Ю.А. Осипьян, С.А. Шевченко, Э.А. Штейнман. ФТТ 26, 677 (1984).
- [2] А.Н. Изотов, А.И. Колюбакин, С.А. Шевченко, Э.А. Штейнман. ДАН СССР 305, 1104 (1989).
- [3] A.N. Izotov, A.I. Kolyubakin, S.A. Shevchenko, E.A. Steinman. Phys. Stat. Sol. (a) **130**, 193 (1992).
- [4] K. Wessel, H. Alexander. Phil. Mag. 35, 1523 (1977).
- [5] W. Barth, M. Bettini, U. Ostertag. Phys. Stat. Sol. (a) 3, K177 (1970).
- [6] G. Packeiser, P. Haasen. Phil. Mag. 35, 821 (1977).
- [7] G. Packeiser. Phil. Mag. 41, 459 (1980).
- [8] V.V. Aristov, Yu.A. Osipyan, R. Scholz, I.I. Snighireva, I.I. Khodos, S.A. Shevchenko. Phys. Stat. Sol. (a) 79, 47 (1983).
- [9] A. Gomez, D.J.H. Cockayne, P.B. Hirsch, V. Vitek. Phil. Mag. 31, 105 (1973).
- [10] H. Gottschalk. J. de Phys. 40, C6-127 (1979).
- [11] J.L. Demenet, P. Grosbras, H. Garen, J.C. Desoyer. Phil. Mag. A 59, 501 (1989).
- [12] V.V. Aristov, I.E. Bondarenko, J. Heidenreich, I.I. Khodos, I.I. Snighireva, P. Werner, E.B. Yakimov. Phys. Stat. Sol. (a) 102, 687 (1987).
- [13] A. Bourret, J. Desseaux-Thibault, F. Lancon. J. de Phys. 44, C4-15 (1983).
- H. Mughrabi. Dislocations-2000. Int. Conf. on the Fundamentals of Plastic Deformation / Eds L. Levcke, L. Kubin, R. Becker. Gasthesrburg, Maryland, USA (2000). Mater. Sci. Eng. A 309–310, 237 (2001).